

英国Ossila四点探针材料薄层电阻、电阻率和电导率试验台T2001A3

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 英国Ossila四点探针材料薄层电阻、电阻率和电导率试验台T2001A3 |
| 公司名称 | 深圳市嘉士达精密仪器有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:英国Ossila 型号:T2001A3 作用:材料薄层电阻、电阻率和电导率测试仪 |
| 公司地址 | 西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100 |
| 联系电话 | 4006608810 18820263964 |

产品详情

四点探针是测量材料薄层电阻最常用的设备。薄层电阻是材料的电阻率除以其厚度，表示通过导电/半导体材料的薄正方形的横向电阻。该测量使用排列成一行的四个探针，每个探针之间的间距相等。电流在外部两个探针之间通过，导致内部两个探针间的电压降低。通过测量电压的这种变化，可以计算出薄层电阻。

Ossila四点探针系统是一种易于使用的工具，用于快速测量材料的薄层电阻、电阻率和电导率。

Ossila四点探针以Ossila源测量单元为核心，是一种低成本的系统，可实现宽的测量范围。探头使用弹簧加载触点而不是尖锐的针头，防止损坏精细的样品，例如厚度在纳米量级的聚合物薄膜。价格包括一个四点探针、内置源测量单元、易于使用的PC软件和一个ITO涂层玻璃基板。测量薄层电阻，以增强其材料特性和薄膜开发计划的能力。

四点探针能够提供1 μ A至200 mA之间的电流，可以测量低至100 μ V至10 V的电压。该系统可以测量100 m范围内的薄层电阻/ 至10 M / ，使得能够表征广泛的材料。

四点探头的设计考虑到了精细样品的测量，采用镀金、柔和的弹簧加载触点和圆形jiantou。这导致60克的恒定接触力，防止探针刺穿脆弱的薄膜，同时仍然提供良好的电接触。

四点探针测量规格：

电压范围：± 100 μ V至 ± 10 V

电流范围：± 1 μ A至 ± 200 mA（5个范围）

薄层电阻范围：100 m / 至10 M / （欧姆/平方）

| 薄层电阻 | 准确度 | jingque度 | 测量范围 |
|---------|-------|----------|--------|
| 100 m / | ± 8% | ± 3% | 200 mA |
| 1 / | ± 2% | ± 0.5% | 200 mA |
| 10 / | ± 1% | ± 0.5% | 200 mA |
| 100 / | ± 1% | ± 0.05% | 20 mA |
| 1 k / | ± 1% | ± 0.03% | 20 mA |
| 10 k / | ± 1% | ± 0.02% | 2000 A |
| 100 k / | ± 2% | ± 0.05% | 200 A |
| 1 M / | ± 8% | ± 0.5% | 20 A |
| 10 M / | ± 30% | ± 5% | 20 A |

探头间距1.27 mm（0.05 “）

矩形样本大小范围

长边最小值：5 mm (0.20 “)

短边最大值：60 mm (2.36 “)

圆形样品尺寸范围 (直径) 5 mm至76.2 mm (0.20 “ x 3.00 ”)

最大样品厚度10 mm (0.39 “)

外形尺寸 (宽x高x长) 145mmx 150mmx 240mm (5.71英寸x 5.91英寸x 9.45英寸)

请注意，该系统不适用于硅或其他自然形成绝缘氧化物层的材料。为了测量这种材料，氧化物层需要被探针穿透，这对于该系统使用的弹簧加载的圆形jianduan探针来说可能是不可能的。